# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

Opto I ctronic quantum well device having an optical resonant cavity and sustaining inter subband transitions							
Patent Number:	□ <u>US5818066</u>						
Publication date:	1998-10-06						
Inventor(s):	DUBOZ JEAN-YVES (FR)						
Applicant(s):	THOMSON CSF (FR)						
Requested Patent:	□ <u>EP0776076</u> , <u>B1</u>						
Application Number:	US19960746810 19961118						
Priority Number(s):	FR19950013785 19951121						
IPC Classification:	H01L29/06; H01L33/00						
EC Classification:	G02F1/21S, H01L31/0232, H01L31/0352, H01S5/183, H01S5/34A						
Equivalents:	DE69620350D, DE69620350T, ☐ <u>FR2741483</u> , ☐ <u>JP9172227</u>						
Abstract							
An optoelectronic quantum well device comprises a stack of layers that have different gap widths and constitute quantum wells possessing, in the conduction band, at least two permitted energy levels, this stack of layers being included between two reflection means. The device also comprises a diffraction grating between one of the mirrors and the stack of layers.  Data supplied from the esp@cenet database - 12							

1,

THIS PAGE BLANK (USPTO)

Europäisches Patentamt European Pat nt Office

EP 0 776 076 A1

Office européen des br vets (11)

REFERENCE

(12)

**DEMANDE DE BREVET EUROPEEN** 

(43) Date de publication: 28.05.1997 Bulletin 1997/22

(21) Numéro de dépôt: 96402406.1

(22) Date de dépôt: 12.11.1996

(51) Int CI.6: H01S 3/18, H01S 3/085, H01S 3/19, G02F 1/015, H01L 31/0352

(84) Etats contractants désignés:

DE GB

(30) Priorité: 21.11.1995 FR 9513785

(71) Demandeur: THOMSON-CSF 75008 Paris (FR)

(72) Inventeur: Duboz, Jean-Yves 94117 Arcuell Cedex (FR)

#### (54)Dispositif optoélectronique à puits quantiques

(57)L'invention concerne un dispositif optoélectronique à puits quantiques comportant un empilement de couches (PQ) de largeurs de bandes interdites différentes et constituant des puits quantiques possédant dans

la bande de conduction au moins deux niveaux d'énergie permis, cet empilement de couches étant compris entre deux moyens de réflexion (M1, M2). Il comporte également un réseau de diffraction (RZ) compris entre l'un des miroirs (M1) et l'empilement de couches (PQ).

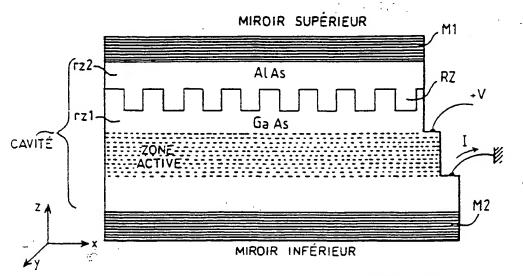


FIG.2a

EP 0 776 076 A1

cavité peut être une microcavité s mblable à celle réalisée dans les lasers VCSEL's ou non, la microcavité offrant en général des avantages n termes d'intégration et de performances. Les réseaux peuvent être à une dimension (une seule polarisation est couplée) ou à deux dimensions (les deux polarisations sont couplées) et peuvent être de forme variable (lamellaire, triangulaire, blazzée ...) sans que le principe de fonctionnement ne soit changé.

Nous allons illustrer ci-dessous les améliorations de performances apportées par l'introduction de micro-cavité pour des dispositifs utilisant des transitions intersousbandes dans des puits GaAs/AlGaAs et fonctionnant à incidence nulle. Ces exemples ne sont pas limitatifs et ne constituent pas des optimisations absolues mais donnent une image réaliste des performances accessibles dans ces structures. Pour les transitions intersousbandes, l'idée peut s'appliquer à la détection, la modulation ou l'émission.

A) Dans la détection et l'émission, il faut distinguer deux 20 cas :

A1) on s'intéresse à une gamme spectrale large (cas des imageurs thermiques usuels). Le spectre du rayonnement incident est large (par exemple 25 8-12 µm), la réponse spectrale du détecteur est large également (par exemple 8-10 µm) et le signal mesuré est proportionnel à la puissance absorbée totale intégrée sur tout le spectre. La microcavité a pour effet de réduire la largeur spectrale en même 30 temps qu'elle augmente la réponse pic, en gardant l'intégrale à peu près constante.

A2) on s'intéresse à la réponse sur un spectre étroit. En particulier, on cherche à obtenir une réponse élevée à une longueur d'onde précise, par exemple la raie 10.6 µm du laser CO<sub>2</sub>. La structure a alors un double avantage : elle augmente la réponse à la longueur d'onde voulue, et en même temps, elle réduit la réponse aux longueurs d'onde voisines qui induisent du bruit sur la mesure.

Deux illustrations vont être données pour la détection. Les processus d'absorption et d'émission étant similaires, les conclusions pour l'émission (fonctionnement en laser) seront les mêmes que pour la détection à une longueur d'onde donnée. En particulier, cette idée s'applique parfaitement aux lasers intersousbandes.

1) On s'intéresse aux détecteurs couplés par un réseau métallisé fonctionnant par réflexion (figure 2b). On utilise ici 40 puits dopés 5x109 cm² avec une courbe d'absorption des puits centrée à 10 µm et de largeur 10 meV Cette zone active va être couplée avec un réseau lamellaire (1 dimension) dont on va optimiser la géométrie pour obtenir la réponse pic maximale. La métallisation sur le réseau constitue un miroir. Cette optimisation est faite dans 3 cas tels que représentés en figures 3a à 3c.

La figure 3a représente la structure de puits quan-

tiques PQ à laquelle est associé un réseau de diffraction RZ, l' nsemble étant réalisé sur un substrat.

La figure 3b représent un dispositif dans lequel l'empilem nt de puits quantiqu s PQ st réalisé sur une couche de guidage G épaisse (3,5 µm) d'indice optique inféri ur à celui des matériaux de l'empilement PQ. Par exemple, la couche G est en AlAs l'empilement PQ est en GaAs/AlGaAs et le substrat est en GaAs. Dans ces conditions, la lumière L arrivant dans le dispositif à travers le substrat traverse le substrat S, la couche G puis l'empilement PQ où elle est partiellement absorbée. La lumière non absorbée atteint le réseau RZ qui la diffracte vers l'empilement PQ qui en absorbe une partie. La lumière non absorbée est réfléchie vers le réseau par l'interface empilement PQ/couche G.

La figure 3c représente un dispositif avec miroir de Bragg M tel que le dispositif de la figure 2b.

Dans les 2 derniers cas, on a une cavité entre 2 miroirs, le métal d'une part et l'interface GaAs/AlAs d'autre part. L'épaisseur de la cavité est choisie pour que la cavité résonne à 10 μm.

La figure 4a montre l'absorption sans AIAs. Le spectre est large et l'absorption pic est faible (9.5 %).

La figure 4b montre l'absorption dans les cas des dispositifs des figures 3b, 3c. Noter les changements d'échelle en abscisses et ordonnées entre les figures 4a et 4b: Les spectres sont étroits et l'absorption pic est forte (48 % avec AlAs épais et 81 % avec le miroir de Bragg). La cavité est plus performante avec le miroir de Bragg qui a un plus fort coefficient de réflexion que la simple couche d'AlAs, le spectre est plus étroit et l'absorption plus forte.

2) On va maintenant illustrer l'effet cavité sur des détecteurs couplés par réseaux diélectriques (GaAs gravé non métallisé) utilisés en transmission. On a une couche de 40 puits quantiques dopés à 10<sup>11</sup>cm-<sup>2</sup> et ayant une transition à 5 μm avec une largeur de 10 meV. Sur la figure 5, on compare l'absorption dans la couche dans deux cas :

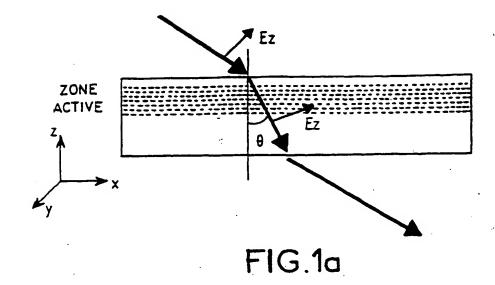
 i) le réseau est gravé dans GaAs et aucune autre structure n'est ajoutée. Il n'y a donc pas de miroir formant cavité. Le spectre d'absorption est large et l'absorption pic est faible (5,6 %).

ii) La structure précédente est recouverte de 3 couches CaF<sub>2</sub>/ZnSe/CaF<sub>2</sub> constituant le miroir supérieur M2 et on dispose sous la zone active 5 périodes de AlAs/GaAs constituant le miroir inférieur M1. Cela correspond au dispositif de la figure 2a. On a donc une cavité. Le spectre d'absorption est étroit et l'absorption pic est importante (43 %) illustrant l'effet microcavité sur l'absorption du détecteur et mettant en évidence l'efficacité de l'invention.

Le dispositif de l'invention peut également fonctionner en modulateur.

Dans le cas d'un modulateur comportant un réseau métallisé comme en figure 2b, le modulateur fonctionne

40



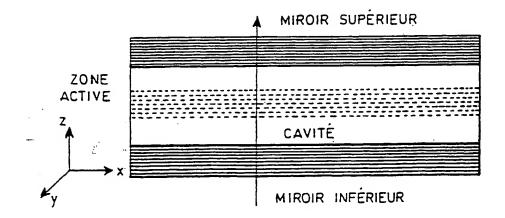
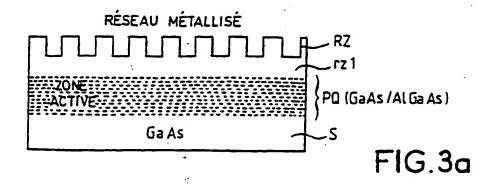
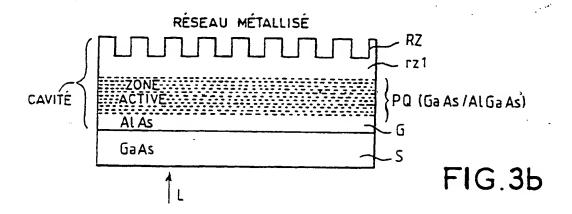


FIG.1b





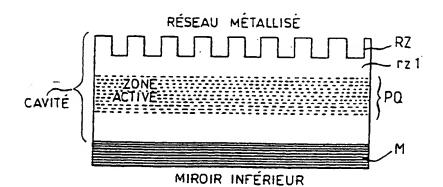


FIG.3c

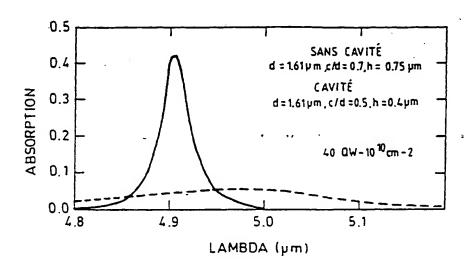
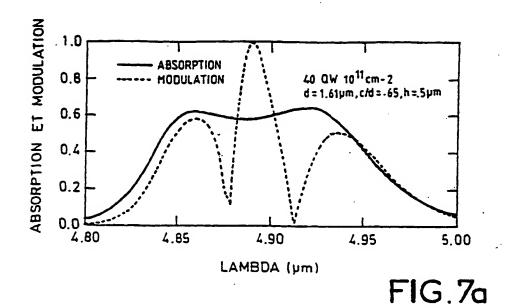
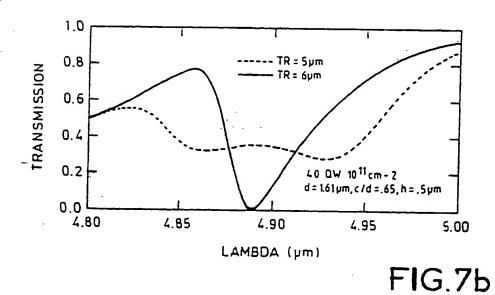


FIG.5







### RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

EP 96 48 2406

atigorie	Citation du document avec des parties per	indication, en cas de besein, rtinentes	Revendication concernie	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (BILCLA)
A	APPLIED PHYSICS LET vol. 66, no. 2, 9 J pages 218-220, XP00 V.BERGER ET AL.: intersubband absorp quantum wells	TERS, Janvier 1995, 12008844 Normal incidence ption in vertical e de gauche, ligne 1 ligne 19 *	1,3	H0153/18 H0153/085 H0153/19 G02F1/015 H01L31/0352
A		Septembre 1988, 9000039349 "Grating enhanceme		• .
Α .	efficiency of AlGaP infrared detectors a doubly periodic g * page 857, colonne * page 858, colonne	Août 1991, 20233772 .: "Near-unity quants/GaAs quantum well using a waveguide with trating coupler" de gauche, alinéa 3 de gauche, ligne 14 de droite; figure 1	th	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (InLCL6) H01S G02F H01L
	3	<b>-/</b>		
	ésent rapport a été établi pour to			
	Lies de la recherche	Date of activement do to rectorche		Economics
X: par Y: par aut A: arm	LA HAYE  CATEGORIE DES DOCUMENTS ( titulièrement pertinent à lui seul titulièrement pertinent en combination re document de la même catégorie ten-plan technologique ultration non-écrite	E : document date de des date de des D : cité dans l L : cité pour d'	principe à la base de l'i le brevet antonour, mai let ou après cette date à demande	is publié à la

13



### RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

EP 96 48 2406

cégorie	Citation du docume des pa	ot avec indication, en cas de besais ties pertinentes	<b>L</b> ,	Revendication concernice	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (bit.CL6)
	1992	(TOSHIBA KAWASAKI Ki gne 45 - colonne 11, 13,26 *		1,2,4,5	
			÷		,
				.	
			,		
					DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (IbLCL6)
				[-	
		•			
	1				
	sest rapport a été établi p	our toutes les revendications  Due d'acterment de la me			
LA HAYE		20 Févrie		Stang	. I
: parti : partic	AFEGORIE DES DOCUME milièrement persinent à lui se milièrement persinent en com document de la même catuge v-plan technologique	E : doc al dati	one ou principe ument de brevet e de dépôt ou ap e dans la demand pour d'autres es	a la base de l'inve anteneur, mais p rés cette date le	